



中华人民共和国国家标准

GB/T 17574.9—2006/IEC 60748-2-9:1994
QC 790106

半导体器件 集成电路 第 2-9 部分:数字集成电路 紫外光擦除电可编程 MOS 只读存储器 空白详细规范

Semiconductor devices—Integrated circuits—
Part 2-9: Digital integrated circuits—
Blank detail specification for MOS ultraviolet light erasable
electrically programmable read-only memories

(IEC 60748-2-9:1994, IDT)

2006-12-05 发布

2007-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

系列国家标准《半导体器件 集成电路》中的数字集成电路部分分为如下几部分：

- GB/T 17574—1998《半导体器件 集成电路 第2部分：数字集成电路》(idt IEC 60748-2:1985)
- GB/T 5965—2000《半导体器件 集成电路 第2部分：数字集成电路 第一篇 双极型单片数字集成电路门电路(不包括自由逻辑阵列)空白详细规范》(idt IEC 60748-2-1:1991)
- GB/T 17023—1997《半导体器件 集成电路 第2部分：数字集成电路 第二篇 HCMOS 数字集成电路 54/74HC、54/74HCT、54/74HCU 系列族规范》(idt IEC 60748-2-2:1992)
- GB/T 17024—1997《半导体器件 集成电路 第2部分：数字集成电路 第三篇 HCMOS 数字集成电路 54/74HC、54/74HCT、54/74HCU 系列空白详细规范》(idt IEC 60748-2-3:1992)
- GB/T 17572—1998《半导体器件 集成电路 第2部分：数字集成电路 第四篇 CMOS 数字集成电路 4000B 和 4000UB 系列族规范》(idt IEC 60748-2-4:1992)
- GB/T 9424—1998《半导体器件 集成电路 第2部分：数字集成电路 第五篇 CMOS 数字集成电路 4000B 和 4000UB 系列空白详细规范》(idt IEC 60748-2-5:1992)
- GB/T 7509—1987《半导体集成电路微处理器空白详细规范》(可供认证用)
- GB/T 14119—1993《半导体集成电路双极熔丝式可编程只读存储器空白详细规范》(可供认证用)
- GB/T 6648—1986《半导体集成电路静态读/写存储器空白详细规范》(可供认证用)
- GB/T 17574.9—2006《半导体器件 集成电路 第2-9部分：数字集成电路 紫外光擦除电可编程 MOS 只读存储器空白详细规范》(IEC 60748-2-9:1994, IDT)
- GB/T 17574.10—2003《半导体器件 集成电路 第2-10部分：数字集成电路 集成电路动态读/写存储器集成电路空白详细规范》(IEC 60748-2-10:1994, IDT)
- GB/T 17574.11—2006《半导体器件 集成电路 第2-11部分：数字集成电路 单电源集成电路电可擦可编程只读存储器空白详细规范》(IEC 60748-2-11:1999, IDT)
- GB/T 17574.12《半导体器件 集成电路 第2-12部分：数字集成电路 可编程器件(PLDs)空白详细规范》(IEC 60748-2-12) (待转化)
- GB/T 17574.20—2006《半导体器件 集成电路 第2-20部分：数字集成电路 低压集成电路族规范》(IEC 60748-2-20:2000, IDT)

本规范等同采用国际电工委员会(IEC)标准 IEC 60748-2-9:1994(QC 790106)《半导体器件 集成电路 第2-9部分：数字集成电路 紫外光擦除电可编程 MOS 只读存储器空白详细规范》(英文版)。

本规范按照 GB/T 1.1 的要求编制国家标准,只对 IEC 原文作编辑性修改：

- 1) 删除 IEC 原文中的前言。
- 2) IEC 原文“静态特性表中‘特性’项漏写‘注5’”,本规范已填写。

本规范的附录 A 为规范性附录。

本规范由中华人民共和国信息产业部提出。

本规范由全国半导体器件标准化技术委员会归口。

本规范起草单位：中国电子科技集团公司第四十七研究所。

本规范主要起草人：施华莎。

半导体器件 集成电路

第 2-9 部分:数字集成电路

紫外光擦除电可编程 MOS 只读存储器

空白详细规范

引言

IEC 电子元器件质量评定体系遵循 IEC 的章程,并在 IEC 的授权下进行工作。该体系的目的是确定质量评定程序,以这种方式使一个参加国按有关规范要求放行的电子元器件无需进一步试验而为其他所有参加国同样接受。

本空白详细规范是半导体器件的一系列空白详细规范之一,并且与下列标准一起使用。

GB/T 4728.12—1996 电气简图用图形符号 第 12 部分:二进制逻辑元件(idt IEC 60 617-12:1991)

GB/T 4937—1995 半导体器件机械和气候试验方法(idt IEC 60749:1984,修改单 1(1991),修改单 2(1993))

IEC 60068-2-17:1978 环境试验 第 2 部分:试验 试验 QC:密封

IEC 60134:1961 电子管、电真空管和类似的半导体器件的额定值体系

IEC 60747-10/QC 700000:1991 半导体器件 分立器件和集成电路 第 10 部分:分立器件和集成电路总规范

IEC 60748-11/QC 790100:1990 半导体器件 集成电路 第 11 部分:半导体集成电路分规范(不包括混合电路)

要求的资料

本页和后面括号内的数字与下列各项要求的资料相对应,这些资料应填入本规范相应的栏中。

详细规范的识别

- [1] 授权发布详细规范的国家标准机构名称。
- [2] 详细规范的 IECQ 编号。
- [3] 总规范和分规范的编号及版本号。
- [4] 详细规范的国家编号、发布日期及国家标准体系要求的其他资料。

器件的识别

- [5] 主要功能和型号。
- [6] 典型结构(材料、主要工艺)和封装资料。
器件若具有若干种派生产品,则应指出其特性差异。
详细规范应给出包括以下内容的简短描述:
 - 工艺(N MOS 等);
 - 结构(字×位);
 - 输出电路的形式(例如三态);
 - 主要功能。